

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

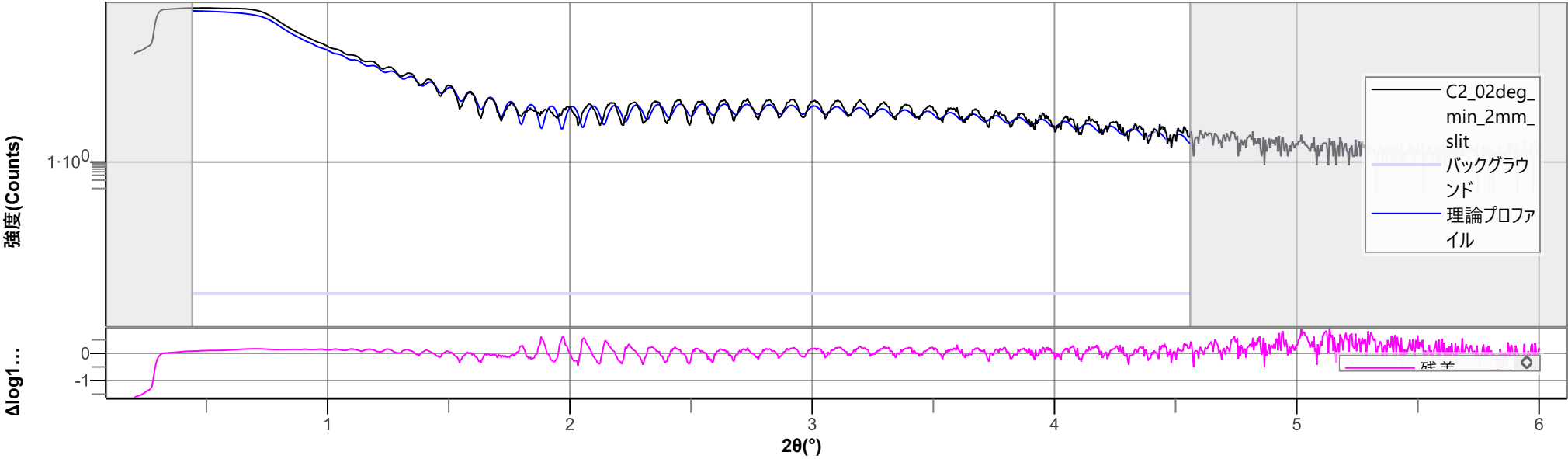
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe2O3	2.598	Const	4.95000	Const	0.000	Con...	
				±0.018	精密化	±0.05	→最大 精密化	±0.02最小←	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	89.856	Const	7.87400	Const	0.100	Con...	
				±0.05	精密化	±0.06	→最大 精密化	±0.03最小←	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	